

JPCA Show 2014 出展通知 (日本电产理德)

2014年6月3日

我们将出展于2014年6月4日(三)至6日(金)开展的JPCA Show 2014。

本年的JPCA Show、「将提供从现有的领域到新领域业界标准(de-facto standard)的检查技术」为主题、增加面向印刷电路板和半导体封装通电检测装置的新产品,触摸屏以及车载用品检查等的新领域、为客户提出最适合的检查解决方案。

【主要展示内容】

- 半导体封装通电检测装置 GATS-7530 / 7510
- 印刷电路板检查装置 STAR REC M6 IIW / STAR REC M6 IISW
- 高速/高精度测试机 R-5810
- 光学式外观检查装置 RSH-S/D120C、 Rwi-300 他
- 检查治具 同軸 MEMS、20um 探针治具、通用型治具
- 触摸屏检查装置 薄膜式 Roll to Roll (供应、绕卷) 机构装置
- 车载相关检查装置 其他

我们期待您的光临。

会場 : 東京国际会展中心 東6会场

会期 : 2014年6月4日(三)~6日(五)

展示位 : 4G-04